

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 0. Einführung | 5 |
| 1. Qualität und Zuverlässigkeit-Definition | 6 |
| 2. Das Qualitätssicherungssystem im VEB Halbleiterwerk- Frankfurt (Oder) | 7 |
| 2.1. Aufgaben und Organisation der Qualitätskontrolle | 10 |
| 2.2. Wareneingangskontrolle | 12 |
| 2.3. Entwicklungs- und Fertigungskontrolle | 17 |
| 2.4. Meßmittelkontrolle, | 24 |
| 2.5. Endkontrolle und Reklamationsbearbeitung | 26 |
| 3. Mathematisch-Statistische Qualitätskontrolle | 55 |
| 3.1. Methode der statistischen Stichprobenprüfung | 55 |
| 4. Zuverlässigkeit | 62 |
| 4.1. Die Bedeutung der Zuverlässigkeit und deren Einflußfaktoren | 62 |
| 4.2. Kenngrößen der Zuverlässigkeit | 64 |
| 4.3. Praktische Ermittlung der Prüfausfallrate | 73 |
| 4.4. Stand und Ergebnisse der Datenrückmeldung | 73 |
| 4.5. Ergebnisse spezieller Prüfungen | 77 |
| 5. Aufgaben und Nutzen der Fehleranalyse | 79 |
| 5.1. Aufgaben der Fehleranalyse | 79 |
| 5.2. Arbeitsschritte der vollständigen Fehleranalyse | 80 |
| 5.3. Fehlernachweisbezogene Untersuchungsmethoden | 90 |
| 5.4. Nutzen der Fehleranalyse | 90 |
| 6. Datenerfassung und Auswertung | 98 |
| 6.1. Datenbank der Qualitätskontrolle | 98 |